



XV Conferenza Associazione Italiana Sensori E Microsistemi

Con la partecipazione straordinaria della Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF) e del Gruppo Sensori della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana (GS-SCI) Italiana (GS)

MESSINA 8-10 Febbraio 2010



.....Grande verdeggia in questo e d'ampie foglie Selvaggio fico;
e alle sue falde assorbe la temuta Cariddi il negro mare. Tre
fiate il rigetta, e tre nel giorno l'assorbe orribilmente...

...Allora incontro ti verranno le belle Spiagge della Trinacria
isola... (Odissea)

La XV edizione della Conferenza Annuale AISEM si terrà quest'anno a Messina, organizzata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, nei giorni 8-10 Febbraio 2010. Lo scopo delle Conferenze AISEM è quello di riunire ricercatori che, in ambito accademico e industriale, si occupano di:

sensori e attuatori;
materiali e tecnologie di processo;
controllo, acquisizione e condizionamento del segnale;
tecniche di elaborazione dei dati e di pattern recognition;
microsistemi, micromacchine e applicazioni innovative.

La Conferenza AISEM è un forum interdisciplinare nel quale si confrontano competenze di fisica, chimica, biologia, ingegneria, scienza dei materiali, etc. ed intende fornire un quadro esaustivo delle competenze disponibili in Italia evidenziando le collaborazioni più proficue tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle seguenti aree:

Materiali, processi e meccanismi di trasduzione:

- Materiali micro e nano strutturati e loro proprietà: sintesi e caratterizzazione
- Tecnologie di fabbricazione e metodi di processo innovativi
- Meccanismi di interazione e di trasduzione del segnale
- Polimeri e materiali a base polimerica
- Biomateriali

Dispositivi:

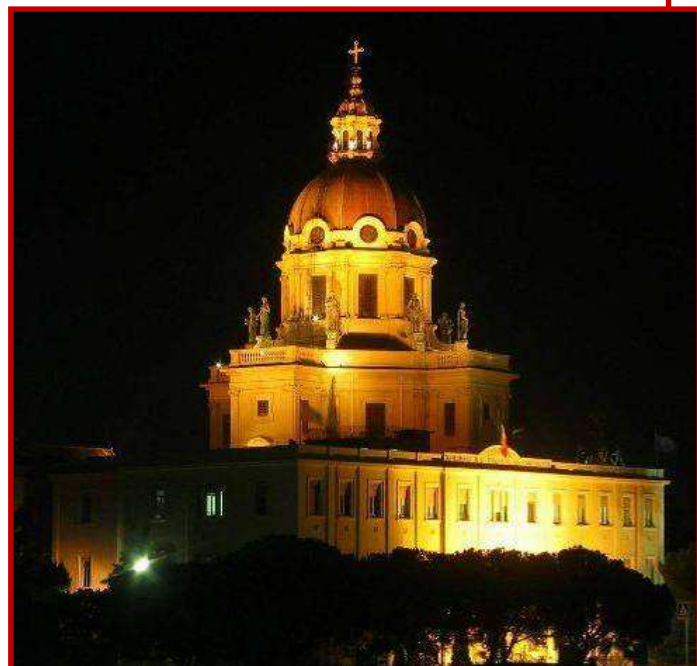
- Sensori per grandezze chimiche
- Sensori per grandezze fisiche
- Sensori per grandezze biologiche
- Attuatori
- Modeling e caratterizzazione funzionale

Sistemi / Microsistemi:

- Metodologie di progettazione
- Sistemi avanzati di interconnessione e di packaging
- Microsistemi analitici
- Sistemi multisensoriali
- Sistemi di riconoscimento e di analisi del segnale
- Micromacchine

Applicazioni:

- Standards
- Monitoraggio ambientale
- Applicazioni biomedicali
- Monitoraggio di specie biologiche
- Automotive
- Controllo di qualità
- Tecnologie dell'informazione





La XV Conferenza AISEM vedrà la partecipazione straordinaria della **Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF)** e del **Gruppo Sensori** della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana (**GS-SCI**).

La Conferenza sarà articolata in Sessioni Orali e Sessioni Poster. Gli abstract, ciascuno di due pagine e redatti in lingua inglese secondo lo schema scaricabile dal sito web, dovranno essere inviati in formato Adobe Portable Document Format (*.pdf) tramite posta elettronica all'indirizzo: aisem2010@ingegneria.unime.it entro il **5 dicembre 2009**. I lavori ricevuti dopo tale scadenza saranno valutati compatibilmente con le esigenze organizzative. Nel messaggio di invio dell'abstract dovrà essere indicata l'area tematica e l'eventuale preferenza per la presentazione orale o poster. La ricezione del contributo sarà confermata da una e-mail di avvenuta ricezione da parte della Segreteria. Nel caso di mancata ricezione di tale e-mail si consiglia il reinvio.

Non resta quindi che darvi appuntamento ad AISEM 2010.

Prof. Signorino Galvagno

Preside Facoltà di Ingegneria,
Dip. di Chimica Industriale e
Ingegneria dei Materiali

Prof. Giovanni Neri

Dip. di Chimica Industriale e
Ingegneria dei Materiali
Tel. 090-397-7297

Dott. Ing. Nicola Donato

Dip. di Fisica della Materia e
Ingegneria Elettronica
Tel. 090-397-7502

Segreteria:

Dott.ssa Mariangela Latino

aisem2010@ingegneria.unime.it

Tel: 090-397-7389

Fax: 090-397-7464

Sito web:

ww2.unime.it/lesst/AISEM2010/AISEM_2010.html

